

Division Spectroscopie d'Electrons SFV

Répertoire des Compétences Nationales en Spectroscopies d'Electrons

Région Sud-Est

Ville	Equipe/Laboratoire /Institut	Moyen Propre	Centre Technique Commun	Plateforme d'Institut	Axes thématique Laboratoire	Description des moyens techniques, compétences ou méthodes synchrotron utilisées	Mode d'accès collaboratif	Mode d'accès contractuel	Nom/Prénom correspondant	Adresse mail - téléphone	Lien	
CLERMONT-FERRAND	Institut Pascal	x		UCA Partner	Semi-conducteurs, III-N, nanolaboration pour le domaine de l'énergie et de l'électronique	XPS, UPS, EELS et EPES, LEED. Chambre de préparation avec dépôts (In, Ga, Au...) et passivation de surface par source type GDS ou ECR, nettoyage ionique profilage (mono et cluster)	x	x	Christine Robert-Goumet Guillaume Monier	christine.robert-goumet@uca.fr, guillaume.monier@uca.fr	<a href="http://www.institutpascal.uca.fr/index.php/fr/minimat/groupe-de-recherche/surface-et-surface">http://www.institutpascal.uca.fr/index.php/fr/minimat/groupe-de-recherche/surface-et-surface</a>	
ECULLY	LTD5-ECL	x			Tribologie Tribochimie	XPS Versa Probe II (Ulvac-PHI)	x	x	Thierry Le MOGNE	Thierry.le-mogne@ec-lyon.fr		
	Science et Surface		x		Société de services	Spectromètre PHI Quanterra SXM avec source monochromatisée Al Ka		x	Jacques Brisot	contact@science-et-surface.fr/jbrisot@science-et-surface.fr	<a href="http://www.science-et-surface.fr">www.science-et-surface.fr</a>	
	INL			NanolYon	oxydes- semiconducteurs	XPS/XPD ( VSW source Al monochromatisée - connecté batis MBE oxydes et III-V -chambre de préparation)	x	x	Geneviève Grenet Claude Botella	genevieve.grenet@ec-lyon.fr claude.botella@eclyon.fr		
FUVEAU	Tescan Analytics	x			Prestataire de service en analyse de surface	XPS, ToF-SIMS					<a href="https://www.tescan-analytics.com/fr/aboutus/subsidiary">https://www.tescan-analytics.com/fr/aboutus/subsidiary</a>	
GRENOBLE	CEA-MINATEC, Plate-Forme de Nano- Caractérisation (PFNC)			x	LITEN (CEA-DRT): Nanomatériaux pour les nouvelles technologies de l'énergie et matériaux pour batteries et piles à combustible; PV. LETI (CEA-DRT): Semi-conducteurs (Inorganiques, organiques), oxydes & III-nitrides pour la nanoélectronique, l'éclairage, les dispositifs de puissance, les microsystèmes, matériaux 2D (graphène, MoS2, WSe2), polymères et bi-dispositifs. IRIG CEA-DRT): Fonctionnalisation de surface, matériaux avancés pour le PV, semi-conducteurs II-VI, spintronique... Utilisation régulière du rayonnement synchrotron: HAXPES (SOLEIL-GALAXIES, SSF-SM2S, Spring8-BL15XU, DESY-P09), PES (SOLEIL-TEMPO, ELETTRA-CPO), XPEEM (ELETTRA-NanoESCA)	XPS Versa Probe II (Ulvac-PHI)		x	Anass Benayad	anass.benayad@cea.fr		
						XPS-UPS Scienta Omicron MultiProbe haute-résolution pour analyses operando et résolues en temps (ms)		x	Eugénie Martinez	eugenie.martinez@cea.fr		
						Imagerie XPS-UPS spectroscopie hte-résolution (XPEEM, EPEEM) NanoESCA (ScientaOmicron)		x	Olivier Renault	olivier.renault@cea.fr		
						Nano-sonde Auger à balayage PHI 700Xi (Ulvac-PHI)		x	Eric de Vito	eric.devito@cea.fr		
									Olivier Renault			
	LTM UMR CNRS/UGA			x	Matériaux et gravure plasma pour les technologies de la microélectronique	XPS Theta Probe ThermoFisher avec valise Adiken pour le transfert des plaques de silicium, connecté au cluster IMPACT	x	x	Bernard Pellissier	bernard.pellissier@cea.fr		<a href="http://tmslab.fr/">http://tmslab.fr/</a>
	LEPMI, SIMAP (Grenoble-INS)	x	x (CMTC)		SIMAP: Réactivité de surface, physique du métal - LEPMI: physico-chimie des matériaux, électrochimie	Auger Riber (moyen propre), XPS Thermo Kalpha (moyen commun)			Grégory Berthomé (SIMAP) Marian Chatenay (LEPMI)	gregory.berthome@simap.grenoble-inp.fr		
	ST Microelectronics (Crolles)	x			Semiconducteurs, dispositifs	XPS PHI Quanterra			Marc Juhel	marc.juhel@st.com		
Constellium Technology Center	x			Métaux et alliages				Aurélien Lefrançois				
Institut Néel (CNRS)	x			STM, croissance in-situ	XPS pour contrôle de la croissance in-situ avant STM			J.-Y. Veullien	jean-yves.veullien@neel.cnrs.fr			
MARSEILLE	CINAM				Mouillage -démouillage	Microscopie électronique à électrons lents			Fabien Cheynis	cheynis@cinam.univ-mrs.fr	<a href="http://www.cinam.univ-mrs.fr/cinam/">http://www.cinam.univ-mrs.fr/cinam/</a>	
						Holographie d'électrons de basse énergie			Mathieu Petit	petit@cinam.univ-mrs.fr		
	IM2NP					LEEM			Frédéric Leroy	leroy@cinam.univ-mrs.fr		
						Inverse Photoemission Spectroscopy (IPES)			Luca Giovanelli	luca.giovanelli@imm2p.fr		
									Jean-Marc Thémelin	jean-marc.themelin@imm2p.fr		
	PIIM					Diffraction d'électrons lents (LEED)			Eric Salomon	eric.salomon@univ-amu.fr		
						Spectroscopie de pertes d'énergie à haute résolution			Thierry Angot	thierry.angot@univ-amu.fr		
								Jean-Marc Layet	jean-marc.layet@univ-amu.fr			
SAINT-ETIENNE	Ecole des Mines			x	Plateforme "Science des Matériaux et Structures	Spectromètre XPS/Auger Theta Probe ThermoFisher et Chambre de Préparation ScientaOmicron pour essais de rupture	x	x	Vincent Barnier Krzysztof Wolski	barnier@emse.fr krzysztof.wolski@mines-st-etienne.fr	<a href="https://www.mines-st-etienne.fr/recherche/structures-scientifiques/plateformes/">https://www.mines-st-etienne.fr/recherche/structures-scientifiques/plateformes/</a>	
SOPHIA-ANTIPOIS	Equipe S&P CEMEF (Centre de Mise en Forme des Matériaux) Ecole des Mines de Paris PSL	x			Tribologie, modifications des surfaces, adhésion.	XPS X-Alpha (ThermoFisher Scientific) Flood Gun, Ion Gun Mono XPS NEXSA G1 (ThermoFisher Scientific) Flood Gun, Ion Gun Mono et Cluster	x	x	Frédéric Georgi	frederic.georgi@minesparis.psl.eu	<a href="https://www.cemef.minesparis.psl.eu/presentation/notre-offre-de-prestation/">https://www.cemef.minesparis.psl.eu/presentation/notre-offre-de-prestation/</a>	
VILLEURBANNE	MATES -INSA			CLYM		Microscopie/spectroscopie des électrons "EELS"		x	Thierry Epicier Mathieu Bugnet	thierry.epicier@insa-lyon.fr, matthieu.bugnet@insa-lyon.fr	<a href="http://www.clym.fr">www.clym.fr</a>	
	ISA	x			Fonctionnalisation de surface	Thermo Fisher Escalab modifié, monochromateur et source FEG pour AES	x	x	François Bessueille	francois.bessueille@univ-lyon1.fr didier.leonard@univ-lyon1.fr		
	ILM			PLYRA		Analyseur Hémisphérique (CLAM IV - VG microtech) Source rayon X Al/Mg 300 W Non monochromatisée source d'électron 20 eV - SkelV, résolution énergie 1 eV source d'ions 0-5 kV porte échantillon 80 k à 550 K			Olivier Boiron Stéphane Pailhes	olivier.boiron@univ-lyon1.fr, stephane.pailhes@univ-lyon1.fr		
	IRCElyon		x		Catalyse	spectromètre AXIS ULTRA DLD de KRATOS ANALYTICAL (XPS et UPS)			Mimoun Aouine Cardenas Luis Eric Ehret	mimoun.aouine@ircelyon.univ-lyon1.fr luis.cardenas@ircelyon.univ-lyon1.fr eric.ehret@ircelyon.univ-lyon1.fr		